

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第6568006号
(P6568006)

(45) 発行日 令和1年8月28日(2019.8.28)

(24) 登録日 令和1年8月9日(2019.8.9)

(51) Int. Cl.	F 1
B 2 4 B 47/26 (2006.01)	B 2 4 B 47/26
B 2 4 B 21/06 (2006.01)	B 2 4 B 21/06
B 2 4 B 7/04 (2006.01)	B 2 4 B 7/04 Z
H O 1 L 21/304 (2006.01)	H O 1 L 21/304 6 2 1 E

請求項の数 7 (全 14 頁)

(21) 出願番号	特願2016-78491 (P2016-78491)	(73) 特許権者	000000239
(22) 出願日	平成28年4月8日(2016.4.8)		株式会社荏原製作所
(65) 公開番号	特開2017-185612 (P2017-185612A)		東京都大田区羽田旭町11番1号
(43) 公開日	平成29年10月12日(2017.10.12)	(74) 代理人	100091498
審査請求日	平成30年9月25日(2018.9.25)		弁理士 渡邊 勇
		(74) 代理人	100118500
			弁理士 廣澤 哲也
		(72) 発明者	柏木 誠
			東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会
			社 荏原製作所内
		(72) 発明者	山下 道義
			東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会
			社 荏原製作所内
		審査官	亀田 貴志

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 研磨装置および研磨方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板を保持する回転可能な基板保持部と、
 研磨具を前記基板に押し付ける押圧部材と、
 前記押圧部材の押圧力を制御するアクチュエータと、
 前記押圧部材と一体に移動可能な位置決め部材と、
 前記押圧部材および前記位置決め部材の移動を制限するストッパーと、
 前記ストッパーを所定の方向に移動させるストッパー移動機構と、
 前記押圧部材に加えられた研磨荷重により変化する荷重フィードバック値を取得する研
 磨荷重検出部と、

前記荷重フィードバック値が設定範囲内に収まるように、前記ストッパーの移動速度を
 決定するストッパー速度決定部とを備えたことを特徴とする研磨装置。

【請求項2】

前記研磨荷重検出部は、前記位置決め部材と前記ストッパーとの間に配置された荷重測
 定器を有し、前記荷重測定器は前記位置決め部材から前記ストッパーに伝達される荷重を
 測定することを特徴とする請求項1に記載の研磨装置。

【請求項3】

前記研磨荷重検出部は、前記荷重測定器によって測定された前記荷重の値を、前記アク
 チュエータが発生した力の値から減算することにより前記荷重フィードバック値を決定す
 る研磨荷重算出器をさらに備えることを特徴とする請求項2に記載の研磨装置。

【請求項 4】

前記荷重フィードバック値は、前記荷重測定器によって測定された前記荷重の値であることを特徴とする請求項 2 に記載の研磨装置。

【請求項 5】

前記研磨荷重検出部は、前記位置決め部材と前記押圧部材との間に配置された荷重測定器を有し、前記荷重フィードバック値は、前記荷重測定器によって測定された前記荷重の値であることを特徴とする請求項 1 に記載の研磨装置。

【請求項 6】

基板を回転させ、
 研磨具を押圧部材で前記基板に押し付け、
 前記押圧部材に連結された位置決め部材の移動をストッパーで制限しながら、前記ストッパーを所定の方向に移動させ、
 前記押圧部材に加えられた研磨荷重により変化する荷重フィードバック値を取得し、
 前記荷重フィードバック値が設定範囲内に収まるように、前記ストッパーの移動速度を決定し、
 前記ストッパーを前記決定された移動速度で前記所定の方向に移動させることを特徴とする研磨方法。

10

【請求項 7】

前記基板は硬さの異なる複数の層を有しており、
 前記ストッパーの移動速度は、前記複数の層の硬さに従って変化することを特徴とする請求項 6 に記載の研磨方法。

20

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、ウェハなどの基板を研磨する研磨装置および研磨方法に関するものであり、特に基板のエッジ部を研磨具で研磨して該エッジ部に階段状の窪みを形成する研磨装置および研磨方法に関する。

【背景技術】

【0002】

半導体デバイスの製造における歩留まり向上の観点から、ウェハの表面状態の管理が近年注目されている。半導体デバイスの製造工程では、種々の材料がシリコンウェハ上に成膜される。このため、ウェハの周縁部には不要な膜や表面荒れが形成される。近年では、ウェハの周縁部のみをアームで保持してウェハを搬送する方法が一般的になってきている。このような背景のもとでは、周縁部に残存した不要な膜が種々の工程を経ていく間に剝離してウェハに形成されたデバイスに付着し、歩留まりを低下させてしまう。そこで、ウェハの周縁部に形成された不要な膜を除去するために、研磨装置を用いてウェハの周縁部が研磨される。

30

【0003】

図 15 は、従来の研磨装置を示す模式図である。研磨されるウェハ W は、露出した表面を形成する第 1 シリコン層 201 と、該第 1 シリコン層 201 の下にあるパターン層 202 と、該パターン層 202 の下にある第 2 シリコン層 203 を備える。ウェハ W を研磨するための研磨テープ 205 は、押圧部材 208 によってウェハ W のエッジ部に押し付けられる。押圧部材 208 はエアシリンダ 209 に連結されており、研磨テープ 205 をウェハ W に押し付ける力はエアシリンダ 209 から押圧部材 208 に付与される。エアシリンダ 209 のロッドには位置決め部材 211 が固定されており、この位置決め部材 211 と押圧部材 208 はエアシリンダ 209 によって一体に移動される。位置決め部材 211 の下面にはストッパー 212 が接触している。したがって、押圧部材 208 および研磨テープ 205 の移動はストッパー 212 によって制限される。ストッパー 212 はボールねじ機構 215 に連結されている。ボールねじ機構 215 は、ストッパー 212 を設定速度で上下に移動させることが可能に構成されている。

40

50

【 0 0 0 4 】

ウェハWの周縁部は次のようにして研磨される。ウェハWのその軸心を中心に回転させながら、ウェハWの上面に液体（例えば純水）が供給される。エアシリンダ209は押圧部材208に一定の押付力を付与し、押圧部材208は研磨テープ205をウェハWのエッジ部に押し付ける。図16(a)および図16(b)に示すように、ウェハWの研磨中、位置決め部材211がストッパ212に接触した状態で、ストッパ212はボールねじ機構215によって一定の速度で下降する。研磨テープ205は、徐々に下降する押圧部材208によってウェハWのエッジ部に押されて、ウェハWのエッジ部を一定の研磨レートで研磨し、ウェハWの周縁部に階段状の窪みを形成する。

【 先行技術文献 】

10

【 特許文献 】

【 0 0 0 5 】

【 特許文献 1 】 特開 2 0 1 4 - 1 5 0 1 3 1 号 公 報

【 発明の概要 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 0 6 】

しかしながら、ウェハWの研磨中に押圧部材208に加えられる研磨荷重は、ウェハWの表面層の硬さに依存して変化する。例えば、第1及び第2シリコン層201, 203はパターン層202よりも柔らかいため、第1及び第2シリコン層201, 203の研磨中に位置決め部材211からストッパ212に伝わる力は、パターン層202の研磨中に位置決め部材211からストッパ212に伝わる力よりも大きい。したがって、パターン層202が研磨されているときの研磨荷重は、第1及び第2シリコン層201, 203が研磨されているときの研磨荷重よりも大きくなる。結果として、研磨荷重が適正範囲を超えることもある。さらに、ウェハWの表面層が硬すぎると、ストッパ212が位置決め部材211から離れてしまい、研磨荷重が過大となる。

20

【 0 0 0 7 】

そこで、本発明は、研磨荷重を適正な範囲内に維持することができる研磨装置および研磨方法を提供することを目的とする。

【 課題を解決するための手段 】

【 0 0 0 8 】

30

本発明の一態様は、基板を保持する回転可能な基板保持部と、研磨具を前記基板に押し付ける押圧部材と、前記押圧部材の押圧力を制御するアクチュエータと、前記押圧部材と一体に移動可能な位置決め部材と、前記押圧部材および前記位置決め部材の移動を制限するストッパと、前記ストッパを所定の方向に移動させるストッパ移動機構と、前記押圧部材に加えられた研磨荷重により変化する荷重フィードバック値を取得する研磨荷重検出部と、前記荷重フィードバック値が設定範囲内に収まるように、前記ストッパの移動速度を決定するストッパ速度決定部とを備えたことを特徴とする研磨装置である。

【 0 0 0 9 】

本発明の好ましい態様は、前記研磨荷重検出部は、前記位置決め部材と前記ストッパとの間に配置された荷重測定器を有し、前記荷重測定器は前記位置決め部材から前記ストッパに伝達される荷重を測定することを特徴とする。

40

本発明の好ましい態様は、前記研磨荷重検出部は、前記荷重測定器によって測定された前記荷重の値を、前記アクチュエータが発生した力の値から減算することにより前記荷重フィードバック値を決定する研磨荷重算出器をさらに備えることを特徴とする。

本発明の好ましい態様は、前記荷重フィードバック値は、前記荷重測定器によって測定された前記荷重の値であることを特徴とする。

本発明の好ましい態様は、前記研磨荷重検出部は、前記位置決め部材と前記押圧部材との間に配置された荷重測定器を有し、前記荷重フィードバック値は、前記荷重測定器によって測定された前記荷重の値であることを特徴とする。

【 0 0 1 0 】

50

本発明の一態様は、基板を回転させ、研磨具を押圧部材で前記基板に押し付け、前記押圧部材に連結された位置決め部材の移動をストッパーで制限しながら、前記ストッパーを所定の方向に移動させ、前記押圧部材に加えられた研磨荷重により変化する荷重フィードバック値を取得し、前記荷重フィードバック値が設定範囲内に収まるように、前記ストッパーの移動速度を決定し、前記ストッパーを前記決定された移動速度で前記所定の方向に移動させることを特徴とする研磨方法である。

本発明の好ましい態様は、前記基板は硬さの異なる複数の層を有しており、前記ストッパーの移動速度は、前記複数の層の硬さに従って変化することを特徴とする。

【発明の効果】

【0011】

本発明によれば、基板の表面層の硬さに依存して変わり得る荷重フィードバック値に基づいてストッパーの移動速度が決定される。ストッパーは決定された移動速度で移動するので、基板の表面層の硬さにかかわらず、研磨荷重を適正な範囲内に維持することができる。

【図面の簡単な説明】

【0012】

【図1】図1(a)および図1(b)は、基板の一例としてのウェハの周縁部を示す拡大断面図である。

【図2】研磨装置の一実施形態を模式的に示す平面図である。

【図3】図2に示す研磨装置を示す側面図である。

【図4】研磨ヘッドを示す図である。

【図5】ウェハを研磨しているときの研磨ヘッドを示す図である。

【図6】荷重フィードバック値を取得する研磨荷重検出部の一実施形態を示す図である。

【図7】本実施形態の研磨装置でウェハの周縁部を研磨したときの荷重フィードバック値とストッパーの移動(下降)速度を示すグラフである。

【図8】ロードセルによって測定された荷重の値を荷重フィードバック値として用いた場合の、荷重フィードバック値とストッパーの移動(下降)速度を示すグラフである。

【図9】ウェハの研磨中にストッパーを一定の速度で移動させたときの荷重フィードバック値とストッパーの移動(下降)速度を示すグラフである。

【図10】ウェハの研磨プロセスを説明するフローチャートである。

【図11】研磨ヘッドの他の実施形態を示す図である。

【図12】研磨ヘッドのさらに他の実施形態を示す図である。

【図13】図13(a)および図13(b)は、研磨始点の決定方法を説明する図である。

【図14】研磨ヘッドのさらに他の実施形態を示す図である。

【図15】従来の研磨装置を示す模式図である。

【図16】図16(a)および図16(b)は、ウェハを研磨している従来の研磨装置を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0013】

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。以下に説明する実施形態に係る研磨装置および研磨方法は、研磨テープの研磨面を基板の周縁部に摺接させることで基板の周縁部を研磨する。ここで、本明細書では、基板の周縁部を、基板の最外周に位置するベベル部と、このベベル部の半径方向内側に位置するトップエッジ部およびボトムエッジ部とを含む領域として定義する。

【0014】

図1(a)および図1(b)は、基板の一例としてのウェハの周縁部を示す拡大断面図である。より詳しくは、図1(a)はいわゆるストレート型のウェハの断面図であり、図1(b)はいわゆるラウンド型のウェハの断面図である。図1(a)のウェハWにおいて、ベベル部は、上側傾斜部(上側ベベル部)P、下側傾斜部(下側ベベル部)Q、および

10

20

30

40

50

側部（アベックス）Rから構成されるウェハWの最外周面（符号Bで示す）である。図1（b）のウェハWにおいては、ベベル部は、ウェハWの最外周面を構成する、湾曲した断面を有する部分（符号Bで示す）である。トップエッジ部は、ベベル部Bよりも半径方向内側に位置する平坦部E1である。ボトムエッジ部は、トップエッジ部とは反対側に位置し、ベベル部Bよりも半径方向内側に位置する平坦部E2である。トップエッジ部は、デバイスが形成された領域を含むこともある。以下の説明では、トップエッジ部を単にエッジ部という。

【0015】

図2は、研磨装置の一実施形態を模式的に示す平面図であり、図3は図2に示す研磨装置を示す側面図である。研磨装置は、基板の一例であるウェハWを保持し、回転させるウェハ保持部（基板保持部）1を備えている。このウェハ保持部1は、ウェハWを保持することができるウェハステージ（基板ステージ）2と、ウェハステージ2をその軸心を中心に回転させるステージモータ3とを有する。研磨されるウェハWは、ウェハステージ2の上面に真空吸引などにより保持され、ウェハステージ2とともにステージモータ3によって回転される。

10

【0016】

研磨装置は、研磨テープ7をウェハWのエッジ部に押し付ける押圧部材11を備えた研磨ヘッド10を有している。押圧部材11は、ウェハステージ2の上方に配置される。研磨テープ7は、ウェハWを研磨するための研磨具である。研磨テープ7の一端は巻き出しリール14に固定され、研磨テープ7の他端は巻き取りリール15に固定されている。研磨テープ7の大部分は巻き出しリール14と巻き取りリール15の両方に巻かれており、研磨テープ7の一部は巻き出しリール14と巻き取りリール15との間を延びている。巻き出しリール14および巻き取りリール15は、それぞれリールモータ17, 18によって反対方向のトルクが加えられており、これにより研磨テープ7にはテンションが付与される。

20

【0017】

巻き出しリール14と巻き取りリール15の間には、テープ送り装置20が配置されている。研磨テープ7は、テープ送り装置20によって一定の速度で巻き出しリール14から巻き取りリール15に送られる。巻き出しリール14と巻き取りリール15との間を延びる研磨テープ7は2つのガイドローラ21, 22によって支持されている。これら2つのガイドローラ21, 22は巻き出しリール14と巻き取りリール15との間に配置されている。ガイドローラ21, 22の間を延びる研磨テープ7の下面は、ウェハWを研磨する研磨面を構成する。研磨具として、研磨テープ7に代えて固定砥粒を用いてもよい。

30

【0018】

研磨ヘッド10は、研磨テープ7をウェハWのエッジ部に押し付ける押圧部材11を備えている。この押圧部材11は2つのガイドローラ21, 22の間に位置している。ウェハWのエッジ部と研磨テープ7との接点において、ガイドローラ21, 22間の研磨テープ7がウェハWの接線方向に延びるようにガイドローラ21, 22が配置されている。

【0019】

ウェハWの研磨は次のようにして行われる。ウェハWは、その表面に形成されている膜（例えば、デバイス層）が上を向くようにウェハステージ2に保持され、さらにウェハWはウェハステージ2とともにその軸心を中心に回転される。回転するウェハWの中心には、図示しない液体供給ノズルから研磨液（例えば、純水）が供給される。この状態で、研磨ヘッド10の押圧部材11は研磨テープ7をウェハWのエッジ部に押し付ける。回転するウェハWと、研磨テープ7との摺接により、ウェハWが研磨される。ウェハWを研磨しているときの研磨テープ7は、図2に示すように、ウェハWと研磨テープ7との接点においてウェハWの接線方向に延びている。

40

【0020】

図4は、研磨ヘッド10を示す図である。図4に示すように、研磨ヘッド10は、研磨テープ7をウェハWに押し付ける上記押圧部材11と、押圧部材11の押圧力を制御する

50

エアシリンダ 25 と、押圧部材 11 とエアシリンダ 25 とを連結する荷重伝達部材 27 とを備えている。エアシリンダ 25 は、ウェハ保持部 1 上のウェハ W に向かう所定の方向に押圧部材 11 を付勢するアクチュエータである。本実施形態では、エアシリンダ 25 は、押圧部材 11 をウェハ W のエッジ部に向かって下方に付勢するように構成されている。本実施形態では、エアシリンダ 25 によって付勢される押圧部材 11 の方向は、ウェハ保持部 1 の軸心と平行な方向、すなわち鉛直方向である。荷重伝達部材 27 の下部は、押圧部材 11 を着脱可能に保持する押圧部材ホルダー 27 a として構成されている。エアシリンダ 25 によって発生した力は、荷重伝達部材 27 を介して押圧部材 11 に伝達される。

【0021】

押圧部材 11 はその内部に形成された貫通孔 11 a を有している。貫通孔 11 a の一端は押圧部材 11 の下面で開口しており、貫通孔 11 a の他端は真空ライン 30 に接続されている。真空ライン 30 には、図示しない弁が設けられており、弁を開くことにより押圧部材 11 の貫通孔 11 a 内に真空が形成される。押圧部材 11 が研磨テープ 7 の上面に接触した状態で貫通孔 11 a に真空が形成されると、研磨テープ 7 の上面は押圧部材 11 の下面に保持される。

10

【0022】

押圧部材 11 は荷重伝達部材 27 に固定されている。さらに、荷重伝達部材 27 には、位置決め部材 31 が固定されている。押圧部材 11、荷重伝達部材 27、および位置決め部材 31 は、一体的な構造体を構成し、エアシリンダ 25 によって一体に移動される。荷重伝達部材 27 は、ウェハ保持部 1 の軸心に沿って延びる直動ガイド 33 に移動自在に連結されている。したがって、押圧部材 11、荷重伝達部材 27、および位置決め部材 31 の全体の移動方向は、ウェハ保持部 1 の軸心と平行な方向に制限される。本実施形態では、ウェハ保持部 1 の軸心は鉛直方向に延びている。

20

【0023】

研磨ヘッド 10 は、位置決め部材 31 の下方に配置されたストッパ 35 と、ストッパ 35 に連結されたストッパ移動機構 37 と、ストッパ 35 上に配置された荷重測定器としてのロードセル 40 をさらに備えている。ストッパ移動機構 37 は、ストッパ 35 を制御された速度で移動させるための装置である。例えば、ストッパ移動機構 37 は、ストッパ 35 に連結されたボールねじ機構と、ボールねじ機構を駆動するサーボモータとを備えている。本実施形態では、ウェハ W の研磨中、ストッパ移動機構 37 はストッパ 35 を下方に移動させる。ストッパ移動機構 37 がストッパ 35 を移動させる方向は、エアシリンダ 25 が押圧部材 11 をウェハ W のエッジ部に向かって付勢する方向と同じである。エアシリンダ 25、直動ガイド 33、およびストッパ移動機構 37 は、フレーム 39 に固定されている。

30

【0024】

ストッパ 35 は、位置決め部材 31 の真下に位置している。したがって、一体的な構造体を形成する押圧部材 11、荷重伝達部材 27、および位置決め部材 31 の下方への移動は、ストッパ 35 によって制限される。ロードセル 40 は、位置決め部材 31 とストッパ 35 との間に配置されている。本実施形態では、ロードセル 40 はストッパ 35 の上面に固定されており、位置決め部材 31 の下面に接触可能となっている。エアシリンダ 25 によって押圧部材 11、荷重伝達部材 27、および位置決め部材 31 が下降されると、位置決め部材 31 はロードセル 40 に接触する。このとき、ロードセル 40 は、位置決め部材 31 からストッパ 35 に伝達される荷重を測定することができる。

40

【0025】

ウェハ W のエッジ部は次のようにして研磨される。図 5 に示すように、ウェハ W のその軸心を中心に回転させながら、ウェハ W の上面に純水などの研磨液（図示せず）が供給される。エアシリンダ 25 は押圧部材 11 をウェハ W に向かって付勢し、押圧部材 11 は研磨テープ 7 をウェハ W のエッジ部に押し付け、該エッジ部を研磨する。ウェハ W の研磨中、エアシリンダ 25 は一定の力を発生する。さらに、ウェハ W の研磨中、ストッパ 35 は位置決め部材 31 の下方への移動を制限しながら、ストッパ 35 はストッパ移動機

50

構 3 7 によって下降される。ストッパ 3 5 の下降に伴い、押圧部材 1 1 および位置決め部材 3 1 は一体に下降する。言い換えれば、ウェハ W の研磨中、ストッパ 3 5、押圧部材 1 1、および位置決め部材 3 1 の相対位置は一定（すなわち不変）である。研磨テーブル 7 は、下降する押圧部材 1 1 によってウェハ W のエッジ部に押され、ウェハ W の周縁部に階段状の窪みを形成する。

【 0 0 2 6 】

ウェハ W の研磨中、エアシリンダ 2 5 によって発生した力の一部は、位置決め部材 3 1 からロードセル 4 0 を介してストッパ 3 5 に伝達される。したがって、押圧部材 1 1 に加えられる研磨荷重は、エアシリンダ 2 5 によって発生した力よりも小さい。ロードセル 4 0 は、この位置決め部材 3 1 からストッパ 3 5 に伝達される力（荷重）を測定し、この荷重の測定値を研磨荷重算出器 4 1 に送るように構成されている。研磨荷重算出器 4 1 は、ロードセル 4 0 によって測定された荷重の値と、エアシリンダ 2 5 によって発生された力の値とに基づいて、研磨荷重の値を算出する。より具体的には、研磨荷重算出器 4 1 は、ロードセル 4 0 によって測定された荷重の値を、エアシリンダ 2 5 が発生した力の値から減算することによって、研磨荷重の値を決定する。

10

【 0 0 2 7 】

本実施形態では、研磨荷重に従って変化する荷重フィードバック値は、研磨荷重算出器 4 1 によって算出された研磨荷重の値である。図 6 に示すように、荷重フィードバック値を取得する研磨荷重検出部 4 2 は、ロードセル 4 0 と研磨荷重算出器 4 1 とから構成される。一実施形態では、研磨荷重に従って変化する荷重フィードバック値は、ロードセル 4 0 によって測定された荷重の値であってもよい。この場合は、荷重フィードバック値を取得する研磨荷重検出部 4 2 は、ロードセル 4 0 から構成され、研磨荷重算出器 4 1 は設けなくてもよい。

20

【 0 0 2 8 】

ストッパ 3 5 の下降速度が一定であるとき、研磨荷重は、ウェハ W の表面層の硬さによって変わり得る。具体的には、ウェハ W の表面層が硬い場合には、研磨荷重は大きく、ウェハ W の表面層が柔らかい場合には、研磨荷重は小さくなる。本実施形態で研磨されるウェハ W は、図 1 5 に示すように、硬さの異なる複数の層を有している。このため、ウェハ W の研磨が進行するにつれて、研磨荷重が変動することがある。研磨荷重の大きな変動は、研磨効率を不安定にする。例えば、研磨荷重が大きすぎると、研磨テーブル 7 に過大な圧力が印加され、一方で、研磨荷重が小さすぎると、研磨効率が低下する。

30

【 0 0 2 9 】

そこで、本実施形態に係る研磨装置は、研磨荷重を適正な範囲内に収めることができるストッパ 3 5 の移動速度を決定するストッパ速度決定部 4 3 を備えている。このストッパ速度決定部 4 3 は、研磨荷重検出部 4 2（本実施形態ではロードセル 4 0 と研磨荷重算出器 4 1）によって取得された荷重フィードバック値に基づいてストッパ 3 5 の移動速度を決定するように構成されている。研磨荷重算出器 4 1 はストッパ速度決定部 4 3 に接続されており、研磨荷重算出器 4 1 によって得られた荷重フィードバック値はストッパ速度決定部 4 3 に送られる。ストッパ速度決定部 4 3 は、ストッパ移動機構 3 7 に接続されており、決定されたストッパ 3 5 の移動速度の値はストッパ移動機構 3 7 に送られる。ストッパ移動機構 3 7 は、ストッパ 3 5 を上記決定された移動速度で移動（下降）させる。

40

【 0 0 3 0 】

ストッパ速度決定部 4 3 には、研磨荷重の適正範囲に対応する設定範囲が予め記憶されている。この設定範囲は、適正な研磨荷重が押圧部材 1 1 に加わるように予め定められた範囲である。ストッパ速度決定部 4 3 には、さらに、荷重目標値が予め記憶されている。この荷重目標値は、上記設定範囲内の値である。ストッパ速度決定部 4 3 は、荷重目標値と、研磨荷重検出部 4 2（本実施形態ではロードセル 4 0 と研磨荷重算出器 4 1）によって取得された荷重フィードバック値との偏差を最小とすることができるストッパ 3 5 の移動速度（下降速度）を決定するように構成されている。例えば、ストッパ速度

50

決定部 4 3 は、PID 制御などのフィードバック制御を実行して、上記偏差を最小とすることができるストッパー 3 5 の移動速度を決定する。このようなフィードバック制御により、押圧部材 1 1 に加えられる研磨荷重は、ウェハ W の研磨中に、適正な範囲内に維持される。

【 0 0 3 1 】

本実施形態によれば、ストッパー 3 5 の移動速度は、ウェハ W の研磨中、ウェハ W の表面層（被研磨層）の硬さに従って変化する。したがって、ウェハ W の表面層の硬さにかかわらず、押圧部材 1 1 に加えられる研磨荷重は、適正な範囲内に維持される。

【 0 0 3 2 】

図 7 は、本実施形態の研磨装置でウェハの周縁部を研磨したときの荷重フィードバック値とストッパー 3 5 の移動（下降）速度を示すグラフである。この実験では、図 1 5 に示すウェハが研磨された。ウェハの研磨は時間 t_1 で開始され、時間 t_2 で終了された。本実験における荷重フィードバック値は、研磨荷重算出器 4 1 によって算出された研磨荷重の値である。符号 S 1 はウェハの第 1 シリコン層 2 0 1（図 1 5 参照）が研磨された区間を表し、符号 S 2 はウェハのパターン層 2 0 2（図 1 5 参照）が研磨された区間を表し、符号 S 3 はウェハの第 2 シリコン層 2 0 3（図 1 5 参照）が研磨された区間を表す。さらに、符号 TL は、荷重目標値を表す。図 7 に示すように、ウェハの研磨中、研磨される層の硬さによってストッパー 3 5 の移動速度が変化し、その一方で荷重フィードバック値は L 1 から L 2 までの設定範囲内に収まった。

【 0 0 3 3 】

研磨荷重に従って変化する荷重フィードバック値として、ロードセル 4 0 によって測定された荷重の値を用いてもよい。この場合は、研磨荷重検出部 4 2 はロードセル 4 0 から構成される。図 8 は、ロードセル 4 0 によって測定された荷重の値を荷重フィードバック値として用いた場合の、荷重フィードバック値とストッパー 3 5 の移動（下降）速度を示すグラフである。この実施形態でも、荷重フィードバック値は L 1 から L 2 までの設定範囲内に収まった。図 8 に示す設定範囲 L 1 ~ L 2 は、図 7 に示す設定範囲 L 1 ~ L 2 とは異なる範囲でもよい。

【 0 0 3 4 】

ウェハ W がウェハ保持部 1 から外れた場合やロードセル 4 0 が故障した場合などの種々の原因により、荷重フィードバック値および/または決定されたストッパー 3 5 の移動速度の値が過度に上昇または低下することがある。そこで、ウェハ W の研磨中に、荷重フィードバック値が設定範囲（L 1 から L 2 まで）から外れた場合、および/または、決定されたストッパー 3 5 の移動速度の値が所定範囲（M 1 から M 2 まで）から外れた場合には、ストッパー速度決定部 4 3 は警報信号を発するようにしてもよい。

【 0 0 3 5 】

図 9 は、ウェハの研磨中にストッパー 3 5 を一定の速度で移動させたときの荷重フィードバック値とストッパー 3 5 の速度を示すグラフである。この実験でも同様に、図 1 5 に示すウェハが研磨された。本実験における荷重フィードバック値は、研磨荷重算出器 4 1 によって算出された研磨荷重の値である。図 9 に示すように、この実験では、荷重フィードバック値は設定範囲を超えて増加した。図 7 のグラフと図 9 のグラフとの対比から分かるように、本実施形態の研磨装置および研磨方法は、ウェハの研磨中にストッパー 3 5 の移動速度、すなわち押圧部材 1 1 の移動速度を変えることによって、荷重フィードバック値、すなわち研磨荷重を適正な範囲内に収めることができる。

【 0 0 3 6 】

次に、ウェハ W の研磨プロセスについて、図 1 0 を参照して説明する。まず、研磨テーブル 7 がウェハ W のエッジ部から十分に離れた状態で、位置決め部材 3 1 がストッパー 3 5 上のロードセル 4 0 に接触するまで、押圧部材 1 1 がエアシリンダ 2 5 によって下降される（ステップ 1）。ストッパー移動機構 3 7 は、位置決め部材 3 1 がロードセル 4 0 に接触した状態で、ストッパー 3 5 を初期設定速度で下降させる（ステップ 2）。ストッパー 3 5 の下降に伴い、位置決め部材 3 1、押圧部材 1 1、および研磨テーブル 7 は、同じ速度

10

20

30

40

50

で一体に下降する。研磨テーブル7がウェハWのエッジ部に接触した時点で、ウェハWの研磨が開始される(ステップ3)。研磨テーブル7は、下降する押圧部材11によってウェハWのエッジ部に押し付けられ、ウェハWを研磨する。ウェハWの研磨中、ロードセル40は、位置決め部材31からストッパ35に伝達される荷重を測定し、研磨荷重算出器41は、ロードセル40から送られた測定値とエアシリンダ25が発生した力とに基づいて、研磨荷重の値を算出する(ステップ4)。

【0037】

ストッパ速度決定部43は、研磨荷重目標値と、研磨荷重の算出値(荷重フィードバック値)との偏差を最小とすることができるストッパ35の移動速度(下降速度)を決定する(ステップ5)。決定されたストッパ35の移動速度の値はストッパ移動機構37に送られる。ストッパ移動機構37は、ストッパ35を上記決定された移動速度で移動(下降)させる(ステップ6)。ウェハWの研磨は、予め設定された目標研磨量に到達したときに終了される(ステップ7)。ウェハWの研磨が終了すると、ストッパ35が、位置決め部材35および押圧部材11とともに上昇する(ステップ8)。

10

【0038】

図4に示すように、ロードセル40は位置決め部材31とストッパ35との間に配置されている。本実施形態ではロードセル40はストッパ35の上面に固定されているが、図11に示すようにロードセル40は位置決め部材31の下面に固定されてもよい。さらに、一実施形態では、ロードセル40は、位置決め部材31と押圧部材11との間に配置されてもよい。例えば、図12に示すように、ロードセル40は、荷重伝達部材27に組み込まれてもよい。

20

【0039】

図12に示す実施形態では、ロードセル40は、位置決め部材31と押圧部材11との間に配置されており、研磨荷重を直接測定することができる。この実施形態では、研磨荷重に従って変化する荷重フィードバック値を取得する研磨荷重検出部42は、荷重測定器であるロードセル40から構成される。本実施形態では、荷重フィードバック値は、ロードセル40によって測定された荷重の値である。なお、ロードセル40をエアシリンダ25と位置決め部材31との間に配置することはできない。その理由は、その位置に配置されたロードセル40は、エアシリンダ25が発生した力そのものを測定することはできるが、押圧部材11に加えられる研磨荷重は測定できないからである。

30

【0040】

ウェハWの研磨は、目標研磨量に達した時点で終了される。ウェハWを目標研磨量だけ正確に研磨するためには、研磨始点を決定する必要がある。そこで、研磨始点の決定方法について図13(a)および図13(b)を参照しつつ説明する。まず、ストッパ移動機構37によりストッパ35を上昇させ、またはエアシリンダ25により位置決め部材31を下降させて、位置決め部材31とロードセル40とを互いに接触させる(図13(a)参照)。

【0041】

次に、位置決め部材31とロードセル40との接触を保ちながら、エアシリンダ25およびストッパ移動機構37により位置決め部材31およびストッパ35を下降させ、研磨テーブル7および押圧部材11をウェハWのエッジ部に向かって移動させる。この移動中、研磨テーブル7、押圧部材11、位置決め部材31、ロードセル40、およびストッパ35は一体に移動する。研磨テーブル7がウェハWのエッジ部に接触した瞬間に、ロードセル40は位置決め部材31から離間する(図13(b)参照)。この瞬間のストッパ35の位置はストッパ35の初期位置であり、この初期位置が研磨始点に決定される。ロードセル40が位置決め部材31から離間した時点は、ロードセル40の出力信号の変化から決定することができる。

40

【0042】

位置決め部材31には、距離センサ50が固定されている。この距離センサ50は、位置決め部材31に対するストッパ35の距離を測定することができる。ロードセル40

50

が位置決め部材 3 1 から離間した時点は、距離センサ 5 0 の出力信号の変化から決定してもよい。ロードセル 4 0 の故障などに起因して、ウェハ W の研磨中に、ストッパ 3 5 が位置決め部材 3 1 から大きく離れたときに、警報信号を発信してもよい。具体的には、ストッパ 3 5 と位置決め部材 3 1 との距離がしきい値を超えたときに、警報信号を発信してもよい。

【 0 0 4 3 】

研磨量は、研磨テーブル 7 によってウェハ W の周縁部に形成された窪みの深さに対応する。したがって、目標研磨量は、上記初期位置から移動したストッパ 3 5 の距離（以下、ストッパ 3 5 の移動距離という）で表すことができる。目標研磨量に相当するストッパ 3 5 の移動距離に到達した時点で、ウェハ W の研磨が終了される。ストッパ 3 5 の移動距離は、ストッパ移動機構 3 7 を構成するサーボモータに内蔵されたロータリエンコーダによって測定することができる。あるいは、図 1 4 に示す距離センサ 5 1 によって測定された押圧部材 1 1 の移動距離が、目標研磨量に相当する距離に達した時点で、ウェハ W の研磨を終了してもよい。この距離センサ 5 1 は、フレーム 3 9 に固定されており、押圧部材 1 1 の移動距離を測定することが可能に構成されている。距離センサ 5 1、エアシリンダ 2 5、およびストッパ移動機構 3 7 の相対位置は固定である。

10

【 0 0 4 4 】

上述した実施形態は、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が本発明を実施できることを目的として記載されたものである。上記実施形態の種々の変形例は、当業者であれば当然になしうることであり、本発明の技術的思想は他の実施形態にも適用しうる。したがって、本発明は、記載された実施形態に限定されることはなく、特許請求の範囲によって定義される技術的思想に従った最も広い範囲に解釈されるものである。

20

【 符号の説明 】

【 0 0 4 5 】

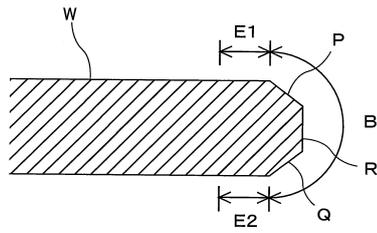
- 1 ウェハ保持部（基板保持部）
- 2 ウェハステージ（基板ステージ）
- 3 ステージモータ
- 7 研磨テーブル
- 1 0 研磨ヘッド
- 1 1 押圧部材
- 1 4 巻き出しリール
- 1 5 巻き取りリール
- 1 7 , 1 8 リールモータ
- 2 0 テープ送り装置
- 2 1 , 2 2 ガイドローラ
- 2 5 エアシリンダ
- 2 7 荷重伝達部材
- 2 7 a 押圧部材ホルダー
- 3 0 真空ライン
- 3 1 位置決め部材
- 3 3 直動ガイド
- 3 5 ストッパ
- 3 7 ストッパ移動機構
- 3 9 フレーム
- 4 0 ロードセル（荷重測定器）
- 4 1 研磨荷重算出器
- 4 2 研磨荷重検出部
- 4 3 ストッパ速度決定部
- 5 0 , 5 1 距離センサ

30

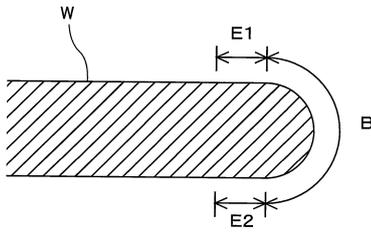
40

【図1】

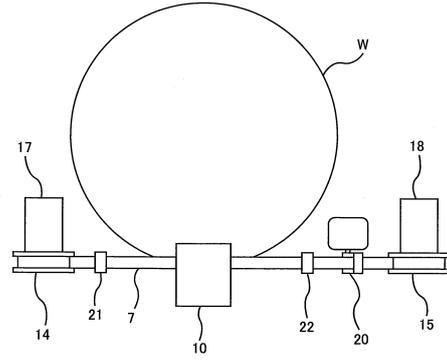
(a)



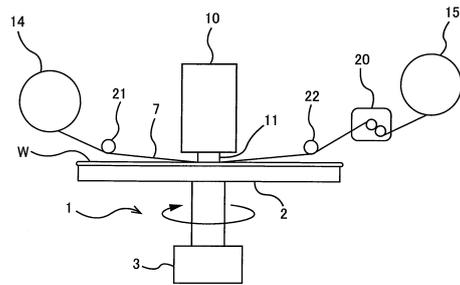
(b)



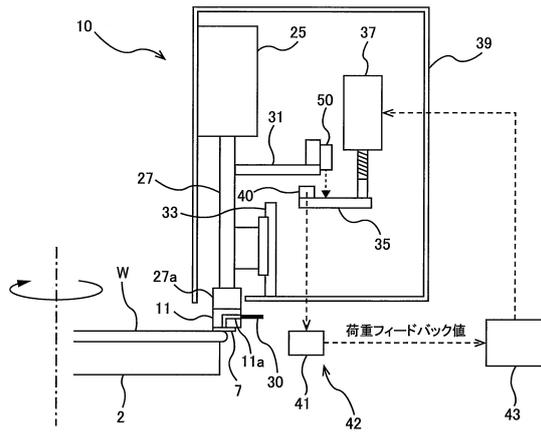
【図2】



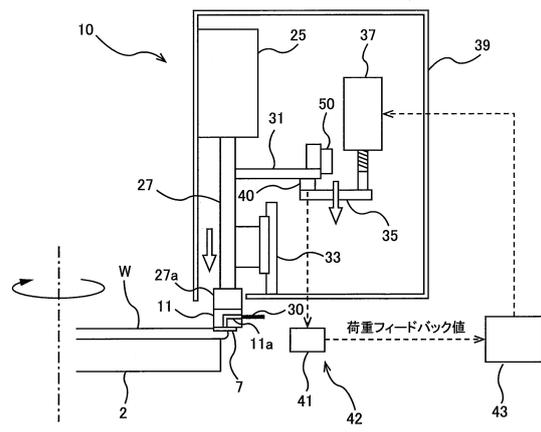
【図3】



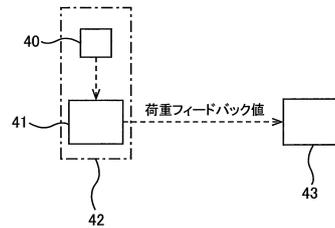
【図4】



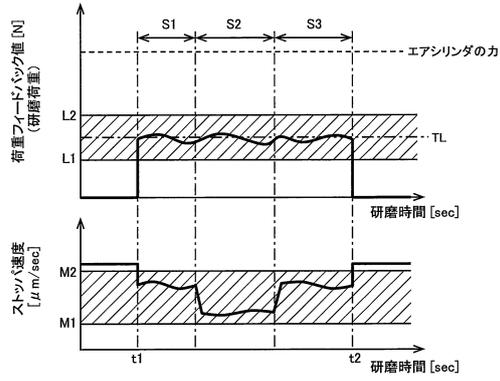
【図5】



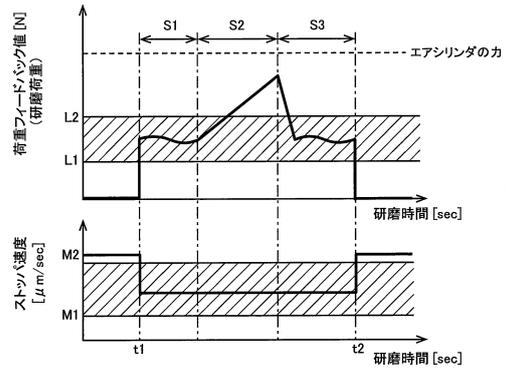
【図6】



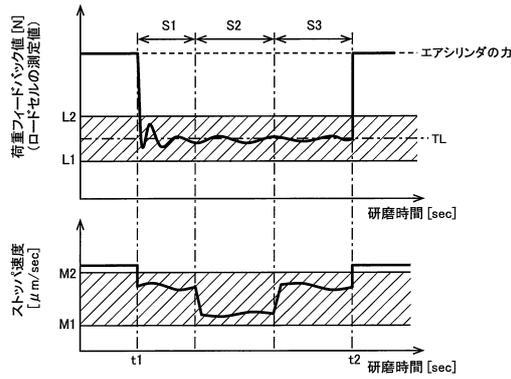
【図7】



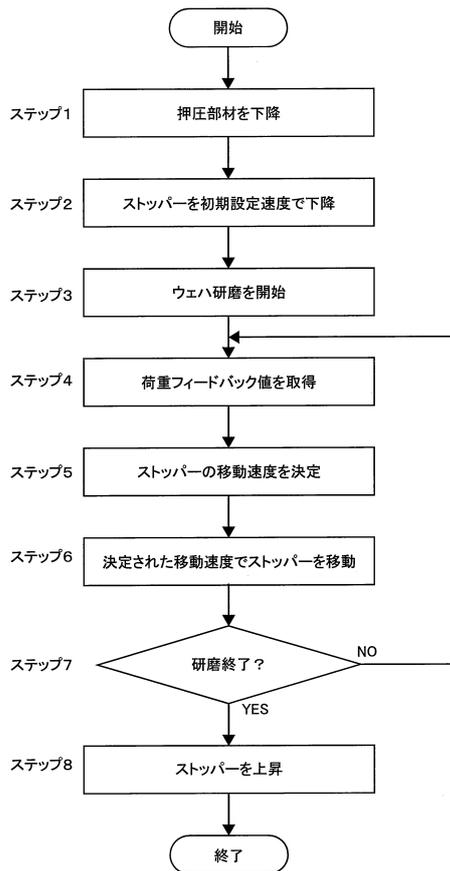
【図9】



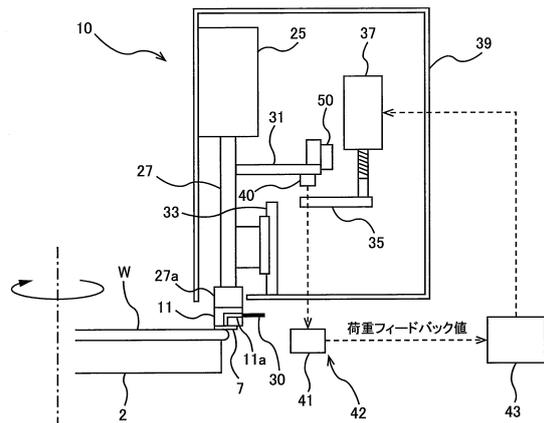
【図8】



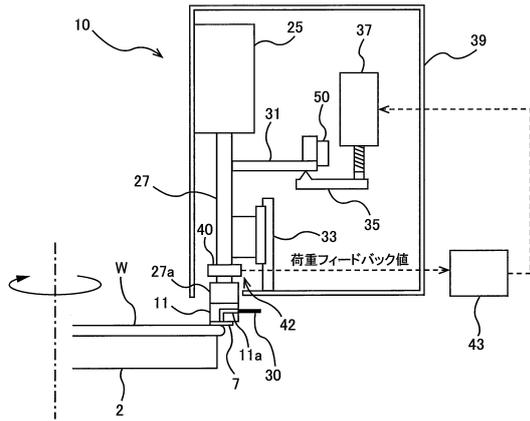
【図10】



【図11】

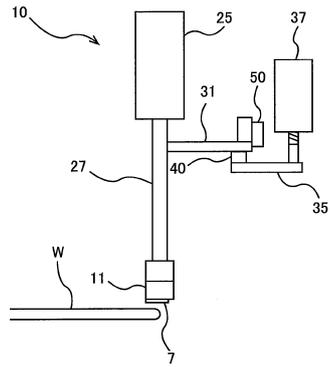


【図12】

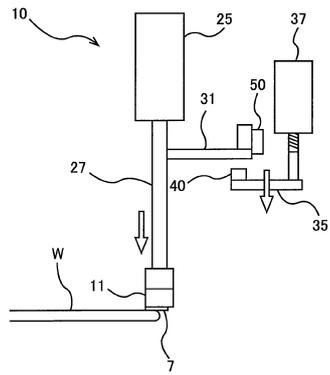


【図13】

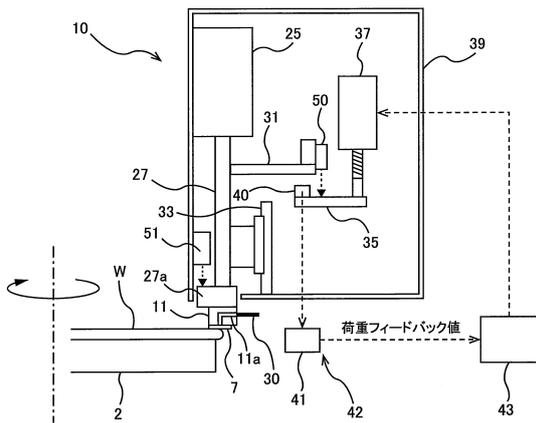
(a)



(b)

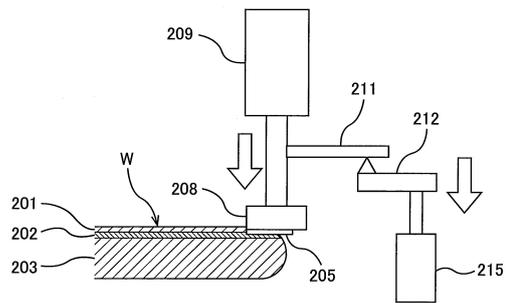


【図14】

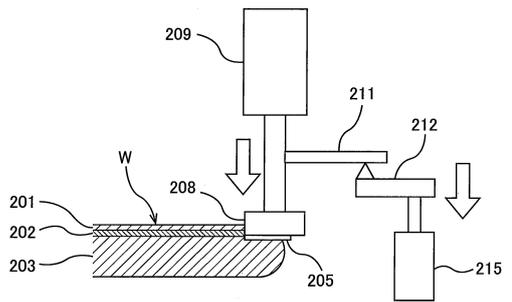


【図16】

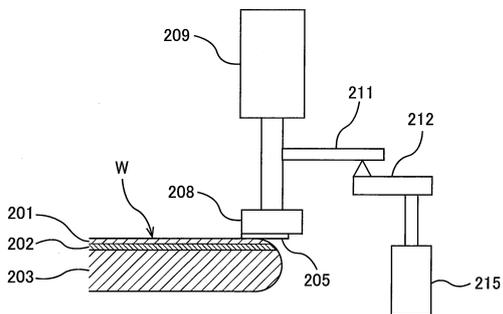
(a)



(b)



【図15】



フロントページの続き

- (56)参考文献 特開2014-150131(JP,A)
特開2001-9685(JP,A)
特開2013-103318(JP,A)
特開2005-038978(JP,A)
米国特許出願公開第2007/0270081(US,A1)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

B24B 47/26
B24B 7/04
B24B 9/00
B24B 21/06
H01L 21/304